

Поэтому в данном диапазоне частот коэффициент прохождения  $T_p^{(4)}$  значительно превосходит  $T_p^{(1)}$ .

## С п и с о к л и т е р а т у р а

- [1] V u c o n i c S. In: 1987 International Conf. on Plasma Phys. Proc. of the Invited Papers / Ed. by A.G. Sitenko. World Scientific. P. 1293.
- [2] Алиев Ю.М., Жаров А.А., Кондратьев И.Г., Фролов А.А. В кн.: Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. Ч. 1. Душанбе: Даниш, 1988. С. 7.
- [3] Красовский В.Л., Ораевский В.Н. // ДАН СССР. 1978. Вып. 242. С. 584.
- [4] I chimaru S., Y akimenco I.P. // Physica Scripta. 1974. V. 10. С. 244.
- [5] Загородний А.Г., Кривцун И.В., Якименко И.П. // Укр. физич. журн. 1977. № 9. С. 1533.
- [6] Гвоздецкий В.С., Загородний А.Г., Кривцун И.В., Корчинский Г.М., Якименко И.П. // Препринт ИТФ-88-110Р. Киев. 1988. 36 с.

Институт теоретической физики  
АН УССР, Киев

Поступило в Редакцию  
17 января 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 13

12 июля 1990 г.

01

© 1990

## ОСОБЕННОСТИ ТУННЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В СИСТЕМАХ ТИПА СТМ

Р.З. Б а х т и з и н, В.Г. В а л е е в,  
А.А. К о в а л ь с к и й

Целью настоящего сообщения является анализ особенностей туннелирования электронов в структурах с узким вакуумным зазором  $d$  (например, СТМ). Малость величины  $d$  приводит к значительному влиянию проводящих „берегов“ на структуру потенциального барьера. Отвлекаясь на первых порах от сложного динамического характера такого влияния, мы ограничимся статическим приближением и сосредоточим внимание на рассмотрении лишь роли довольно очевидного факта существования бесконечного ряда зарядов изображений, порождаемых туннелирующим электроном в „берегах“ вакуумного промежутка.

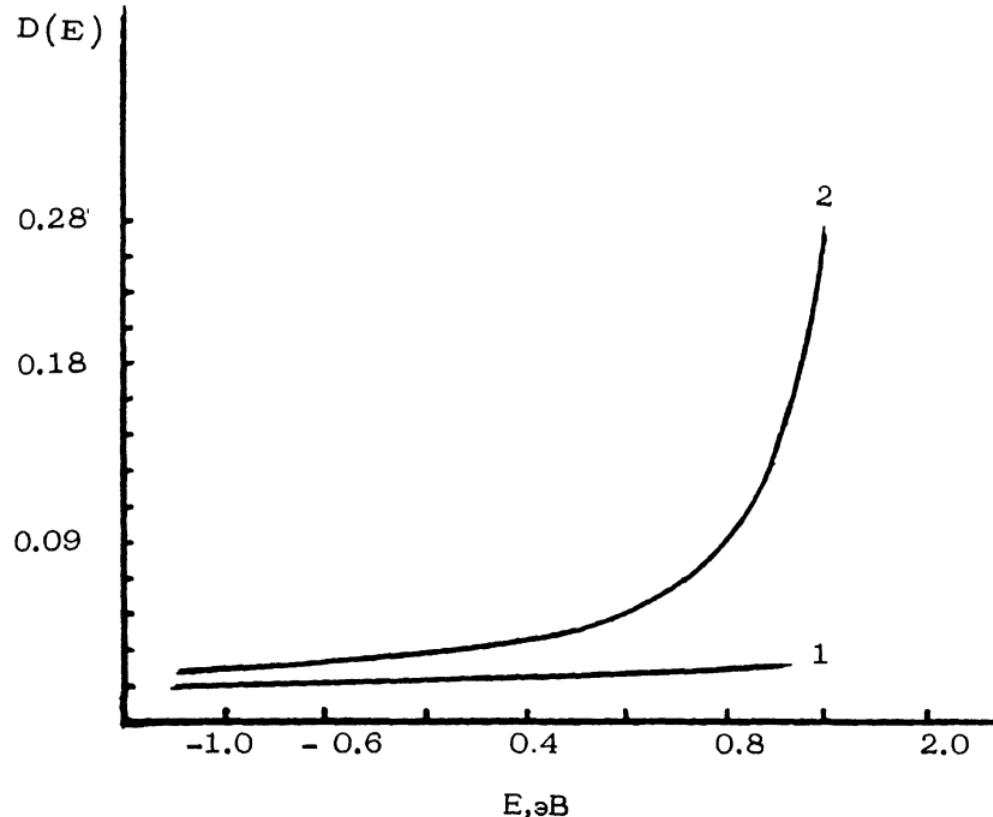


Рис. 1. Зависимость прозрачности потенциального барьера  $D$  от полной энергии туннелирующего электрона  $E$  для конфигурации плоскость-плоскость;  $a$  - величина „зазора” ( $\text{\AA}$ ),  $\varphi V$  - приложенная разность потенциалов (эВ). Значения параметров:  $a = 10 \text{ \AA}$ ,  $\varphi V = 1.4 \text{ эВ}$ . 1 - зависимость  $D(E)$  с учетом одного изображения; 2 - зависимость  $D(E)$  с учетом всей совокупности изображений.

Например, в системе с плоскими „берегами” потенциал сил изображения для туннелирующего электрона имеет вид

$$V_{im}(z) = \sum_i \frac{e\varphi_i}{|z - z_i|}, \quad (1)$$

где  $z$  - координата электрона в зазоре,  $z_i$  - координата  $i$ -го изображения ( $i = 1, 2, \dots$ ), связанная с  $z$  обычной процедурой инверсии последовательно относительно каждой из плоскостей электродов  $\varphi_i$  - заряд  $i$ -го электрического изображения. При этом, как легко видеть, возникают две бесконечные системы зарядов - изображений; для одной первое отражение исходного заряда  $e$

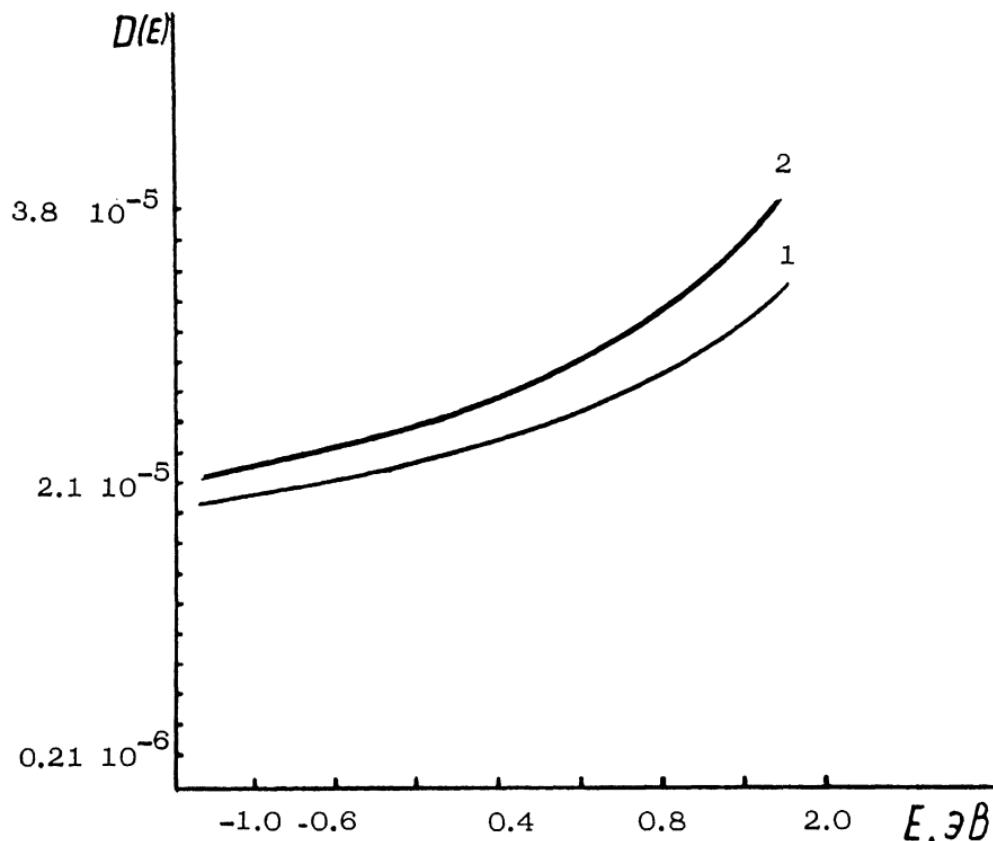


Рис. 2. Зависимость прозрачности потенциального барьера  $D$  от полной энергии туннелирующего электрона  $E$  для конфигурации сфера-плоскость;  $d$  - величина „зазора” ( $\text{\AA}$ ),  $qV$  - приложенная разность потенциалов (эВ). Значения параметров:  $d = 10 \text{ \AA}$ ,  $qV = 1.4 \text{ эВ}$ . 1 - зависимость  $D(E)$  с учетом одного изображения, 2 - зависимость  $D(E)$  с учетом всей совокупности изображений.

производится в левой плоскости, для другой – в правой. Каждая инверсия меняет знак заряда на противоположный.

Функция  $V_{im}(z)$  может быть найдена аналитически и для системы плоскость – сфера радиуса  $R$  [1].

Результаты для прозрачности потенциального барьера  $D$ , полученные в приближении ВКБ [2] с учетом влияния одного изображения (кривые 1) и всей их совокупности (кривые 2) в зависимости от полной энергии туннелирующего электрона  $E$  при характерных значениях  $d$  и разности потенциалов „берегов”  $qV$  приведены на рис. 1 – для конфигурации плоскость – плоскость и на рис. 2 – для конфигурации плоскость – сфера радиуса  $R$  соответственно.

Видно, что действие сил со стороны зарядов – изображений уже в статическом приближении весьма существенно изменяет  $D$ . Заметим, что в обычных для СТМ – эксперимента конфигурациях  $d \sim 5-10$  Å время туннелирования электрона  $\tau \sim d$  значительно превосходит характерное время формирования потенциала сил изображения  $\tau_{\text{рф}} \sim \omega_{\text{рф}}^{-1} \approx 10^{-15}$  с [3]. Поэтому можно ожидать, что динамические эффекты в этом случае малы [4]. Последнее утверждение, впрочем, не является очевидным в применении к далеким изображениям.

## Список литературы

- [1] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.
- [2] Кембле Е.С. The Fundamental Principles of Quantum Mechanics. New York: Mc Graw-Hill, 1937.
- [3] Баскин Л.М., Соколовский Д.Г. // Известия вузов. Физика. 1987. Т. XXX. № 3. С. 26-29.
- [4] Gabovich A.M. et all. // Surf. Sci. 1987. V. 186. P. 523-549.

Башкирский  
государственный  
университет  
им. 40-летия Октября

Поступило в Редакцию  
21 октября 1989 г.  
В окончательной редакции  
24 мая 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 13

12 июля 1990 г.

04

© 1990

## О МЕХАНИЗМЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НИЖНЕГИБРИДНЫХ ТОКОВ УВЛЕЧЕНИЯ В ТОКАМАКАХ

В.Н. Будников, Л.А. Есиев,  
М.А. Ирзак

Создание стационарных токов безындукционным путем является важной задачей в программе термоядерного реактора – токамака. Наибольшие успехи в генерации токов увлечения в настоящее время достигнуты с помощью НГ волн [1]. Однако во всех экспериментах по генерации токов НГ волнами обнаружен предел по плотности  $n_{cr}$ , при переходе через который генерация токов прекращается. Эта „критическая” плотность обычно в несколько раз меньше НГ плотности  $n_{LH}$ . Резкое падение эффективности генерации токов увлечения совпадает с началом генерации быстрых ионов, т.е. с началом сильного взаимодействия волны с ионами, которое обычно связывают с периферийными распадными неустойчивостями [2].